

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ

урочистих наукових зборів Інституту фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН України, присвячених 100-річчю від дня
народження члена-кореспондента АН УРСР

МИХАЙЛА ФЕДОРОВИЧА ДЕЙГЕНА

Дата та
місце
проведення

19 червня 2018 року

актовий зал Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
НАН України, проспект Науки, 41, м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 10.00** Вступне слово директора ІФН НАН України, академіка НАН України **БЄЛЯЄВА О.Є.**
- 10.10** Виступ академіка-секретаря Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, академіка НАН України **ЛОКТЕВА В.М.**
- 10.20** **ШАНІНА Б.Д.**, доктор фізико-математичних наук, професор (ІФН НАН України) «Життєвий та творчий шлях М.Ф. Дейгена»
- 10.45** **КОЧЕЛАП В.О.**, член-кореспондент НАН України (ІФН НАН України). "М.Ф. Дейген і електрон-фононні взаємодії в напівпровідниках"
- 11.00** **ГЛІНЧУК М.Д.**, член-кореспондент НАН України (ІМЗ НАН України). "Залежні від розмірів фазові переходи без критичного розміру та зростання поляризації (reentrant phase) у наноструктурних сегнетоелектриках"
- 11.25** **РЯБЧЕНКО С.М.**, член-кореспондент НАН України (ІФ НАН України). "Прямі і непрямі екситони у подвійних квантових ямах CdMgTe/CdTe/CdMgTe/CdMnTe/CdMgTe". Автори: О.В. Терлецький, С.М. Рябченко (ІФ НАНУ), В.Й. Сугаков, Г.В.Верцимаха (ІЯД НАНУ), V.Yu.Ivanow, L.Owczarczyk, G. Karczewski (ІФ ПАН, Варшава).
- 11.50-12.10** **Перерва на каву**
- 12.10** **КАШИРІНА Н.І.**, кандидат фізико-математичних наук (ІФН НАН України). «Конденсони і біконденсони в низьковимірних системах»
- 12.35** **GERU I.I.**, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova. Institute of Chemistry. "Spin Levels Inversion in Exchange Coupled Pairs under Combined Time Reversal"
- 13.00** **БРАТУСЬ В.Я.**, доктор фізико-математичних наук (ІФН НАН України). "М.Ф. Дейген і експеримент у відділі радіоспектроскопії".
- 13.20** **ШАНІНА Б.Д.**, доктор фізико-математичних наук, професор (ІФН НАН України) «Обчислення з перших принципів констант спін гамільтоніана для протяжних дефектів»